

第91回分析基礎セミナー

プロに学ぶ・X線分析

【日時】 2015/5/14 (木) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・西講義棟3階第4講義室

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社リガク、株式会社島津製作所

13:00-14:55 X線回折を用いた粉末・薄膜材料の評価

X線回折の原理およびX線回折で分かることを粉末試料、薄膜試料を中心にご紹介します。

粉末試料に対しては物質の同定、定量、結晶サイズ解析など、また薄膜試料に対しては低角度入射による測定や配向評価の解析例などをご紹介します。

15:05-17:00 蛍光X線分析の基礎と応用

蛍光X線分析法の特徴、原理、装置、定性分析、定量分析（検量線法、FP法）、分析結果の評価方法、試料前処理、最近のアプリケーションについて説明します。

今年度の分析基礎セミナーは、過去に好評を博した「プロに学ぶ」シリーズです。機器メーカーならではのプロフェッショナルな内容にご期待ください。

今回はX線回折と蛍光X線分析です。現場で困っている方、よりよいデータを取得されたい方にも有用です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力お願いします。途中入退室も自由ですのでご都合に合わせてご参加ください。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp